

## 委託手数料

試験項目	使用機器名	単位	金額
三次元エックス線CT検査(検査時間が1時間まで)	マイクロフォーカスX線CTシステム	1試験1試料	9,680
三次元エックス線CT検査(検査時間が1時間を超えるもの30分につき)		30分	3,810
電界放出形走査電子顕微鏡写真(FE-SEM)	電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)	1試験1試料	7,190
EDS定性分析(固体、粉末)(電界放出形走査電子顕微鏡を用いたもの)		1試験1試料	7,760
EPMA定性分析	電子プローブマイクロアナライザー (EPMA)	1試験1項目	17,000
EPMAデジタルマッピング(4元素まで)		1分析	18,700
EPMAデジタルマッピング(1元素追加につき)		1分析1元素	3,250
電子顕微鏡写真		1試験1試料	5,200
EDS定性分析(固体、粉末)		1試験1試料	6,450
光電子分光分析(XPS)(オージェ電子分光分析を含む) (検査時間が1時間まで)	光電子分光分析装置 (XPS)	1試験1試料	14,700
光電子分光分析(XPS)(オージェ電子分光分析を含む) (検査時間が1時間を超えるもの30分につき)		30分	5,030
赤外分光分析	赤外分光分析装置	1分析	5,240
赤外イメージング		1分析	9,870
精密測定試験(中級)	超高精度三次元測定機	1試験1試料	3,640

## 設備使用料

機械及び器具	単位	金額
汎用シミュレーションシステム	1時間	1,390
電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	1時間	6,610
電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)	1時間	8,820
光電子分光分析装置(XPS)	1時間	12,100
マイクロフォーカスエックス線CTシステム	1時間	7,410
超高精度三次元測定機	30分	3,140
振動解析システム	30分	1,000
赤外分光分析装置	30分	1,990
電磁波半無響システム(電波暗室)	1時間	6,130
電磁波遮蔽システム(シールドルーム)	1時間	1,130
放射エミッション試験装置	1時間	4,090
伝導エミッション試験装置	1時間	3,660
放射免疫試験装置	1時間	3,150
伝導免疫試験装置	1時間	2,080
バルクカレントインジェクション試験装置	1時間	1,830
静電気試験装置	1時間	1,570
電氣的ファストランジエントバースト試験装置	1時間	2,310
雷サージ試験装置	1時間	2,430
電源周波数磁界試験装置	1時間	1,420
電圧ディップ・瞬停試験装置	1時間	1,440
高調波フリッカ試験装置	1時間	1,490
安全規格試験装置	1時間	860
残留電荷試験装置	1時間	940